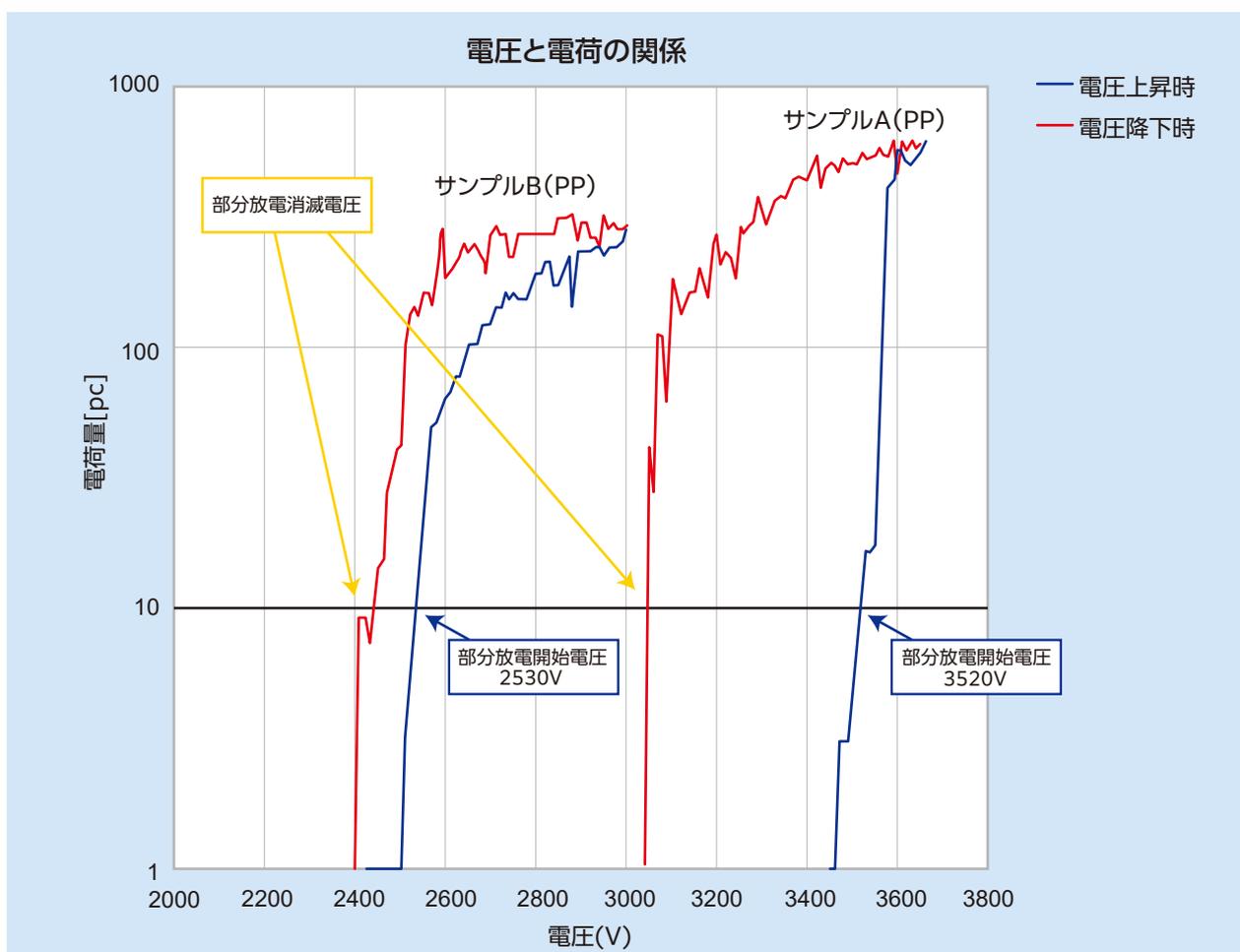


絶縁体中の空隙の非破壊検査(1)

部分放電試験/V-Q(電圧-電荷)試験 (Partial Discharge Test)

絶縁材料中に空隙(ボイド)があると、その部分に電界が集中し、微弱な放電が発生する。これを部分放電とよび、この時の電荷の移動(電荷量)を検出し、材料中の欠陥を非破壊で評価できる。部分放電開始電圧の大小でボイドの程度を評価できる。



サンプルAは、電圧を3700V、サンプルBは電圧を3000Vまでそれぞれ昇圧させた試験で、部分放電をそれぞれ検出した
 サンプルBはサンプルAよりも部分放電開始電圧が低くボイドの程度が悪いことがわかる

▶ 試験条件例

試験規格	IEC60664, JEC-0401等	最高電圧	5000 V
試験環境	23±2 °C/50±5%RH	周波数	50 Hz
試料	絶縁材料, 絶縁シート, 太陽電池のバックシート等		
その他	貴社のご希望の試験条件があれば、対応致します。お気軽にお問い合わせ下さい。		

